

PALABRAS DEL PROFESOR RAFAEL STEINBERG

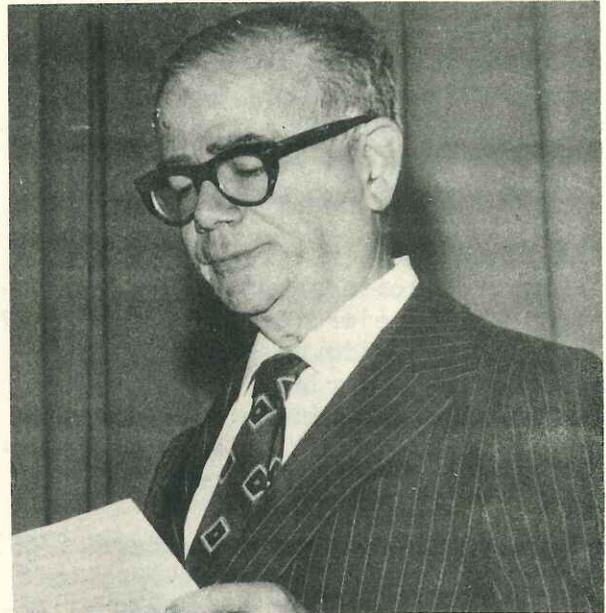
Presidente del SIM

No puede dejar de llamar la atención la circunstancia de que la Convención del Metro fuera firmada en 1875 por los representantes de cuatro países americanos -Argentina, Brasil, Perú y Venezuela sobre un total de diecisiete.

La situación es aún más llamativa cuando se advierte que en las reuniones previas la proporción de países del Nuevo Mundo es aún más elevada, ya que figuran asentadas en las actas de las sesiones de 1872, juntamente con las antes mencionadas, las firmas de los representantes de Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, San Salvador y Uruguay. Diez países latinoamericanos entre treinta asistentes.

Cualquiera sea la razón de este curioso hecho histórico cuya realidad nos limitamos a constatar, las alternativas de la creación del Sistema Interamericano de Metrología, que ayer ha tenido su acta de nacimiento, con la participación de instituciones de catorce países de la región, nos da libertad para imaginar que, de alguna manera, somos continuadores de un proceso que tiene honradas raíces y entronca con los proyectos visionarios de los fundadores de nuestro país, lo cual nos conmueve.

El Sistema Interamericano de Metrología tiene objetivos muy claros y concretos: se trata de promover la cooperación internacional entre los organismos competentes de los países participantes para contri-



buir al perfeccionamiento de las actividades en las áreas de la metrología legal, industrial y científica. A tal efecto, las acciones tenderán a lograr:

- la definición del sistema nacional de cada país;
- el establecimiento de la línea jerárquica de patrones de cada país y su alcance con los de otros países;
- la compatibilidad de los resultados de los procesos de medición correspondientes efectuados en los laboratorios del Sistema;
- la formación de personal científico y técnico;
- la obtención de documentos técnicos y científicos y su distribución;
- finalmente, la vinculación con la Conferencia General de Pesas y Medidas, la Organización Internacional de Metrología Legal y otros organismos nacionales o internacionales especializados en la materia.

Para la realización de estos objetivos, en cuyo cumplimiento ya estamos trabajando desde 1976, con el auspicio del Departamento de Asuntos Científicos de la OEA, hemos contado con el apoyo de las instituciones rectoras, como el Instituto Físico Técnico

co (PTB) de la República Federal de Alemania, el National Bureau of Standard (NBS) de Estados Unidos, y el National Physical Laboratory del Reino Unido, así como con los organismos internacionales de máximo nivel, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). La presencia y participación en esta conferencia de eminentes autoridades de estas instituciones compromete nuestra gratitud porque constituye un poderoso estímulo para nuestra tarea.

Séame permitido además señalar públicamente el nombre de dos personas de quienes nos sentimos especialmente deudores, y que por rara coincidencia, después de haber empleado una vida de trabajo en bien de la comunidad tienen el privilegio de retirarse del servicio activo, metáfora que, debe entenderse, significa que trabajarán más que nunca. El primero de ellos, hoy presente entre nosotros, el ingeniero D. Ramón de Colubi, pionero de la metrología en América, creador de esa obra ejemplar que es el Instituto Nacional de Metrología Legal de Venezuela, y el segundo, el ingeniero H. Steffen Peiser, distinguido científico quien desde su posi-

ción en el NBS ha actuado como lúcido consejero y ha sabido comunicarnos su inquebrantable entusiasmo a quienes hemos emprendido este no fácil camino en una obra que no admite retrocesos. Pido para ellos un aplauso.

Quiero finalmente anunciar que el Sistema Interamericano de Metrología tiene ya su órgano propio de comunicación. Si bien el primer número de Carta Metrológica tiene un contenido predominante de material histórico es porque hemos considerado necesario documentar el desarrollo del proyecto. Aspiramos a que Carta Metrológica sea una publicación científica especializada y la ofrecemos como vehículo para la edición de trabajos relacionados con el tema.

La Conferencia Interamericana de Metrología que hoy se inicia, y que constituye una de las formas en que se manifiesta el Sistema Interamericano de Metrología, al mismo tiempo que nos da la oportunidad única de escuchar las exposiciones magistrales que estarán a cargo de nuestros distinguidos invitados, nos permitirá exponer un panorama, forzosamente reducido, de algo de lo que se hace en nuestros países en este campo.